

## JIS 見直し及び JIS 確認の申出に係る審議について

日本産業規格（以下、JIS という。）は、産業標準化法に基づき、JIS を制定又は確認若しくは改正した日から少なくとも 5 年を経過するまでに見直す必要があります。多数の JIS があることから効率的な運用のために、毎年度一括して JIS 見直しを行うこととしております。JIS の見直しの流れ及び産業標準作成委員会の審議方法は、別添 1 をご参照ください。

なお、別添 1 のとおり「JIS 作成予定一覧表の公表」、「利害関係者の産業標準作成委員会への参加の確保」及び「異議申立ての機会の確保及び廃止のみ意見受付公告」の過程で、利害関係者から意見等があった場合で、議決結果の変更又は意見等を採用しない場合は、再度、産業標準作成委員会にお諮りいたします。また、字句等編集上の修正については、事務局に一任いただきますようお願いいたします。

### （１）JIS 見直しの審議

2026 年度に見直し期限を迎える JIS について、当会にて関係各方面の意見を十分に調査し、別添 2 のとおり 2026 年度中に改正、確認又は廃止とするかの案を作成いたしましたので、ご審議をお願いいたします。ご承認いただいた JIS 見直しのうち、公示予定が「確認」、及び公示予定が「廃止」、かつ、これから廃止に着手する JIS については、その内容を利害関係者に公表するために JIS 作成予定一覧表として JSA ホームページに掲載いたします。

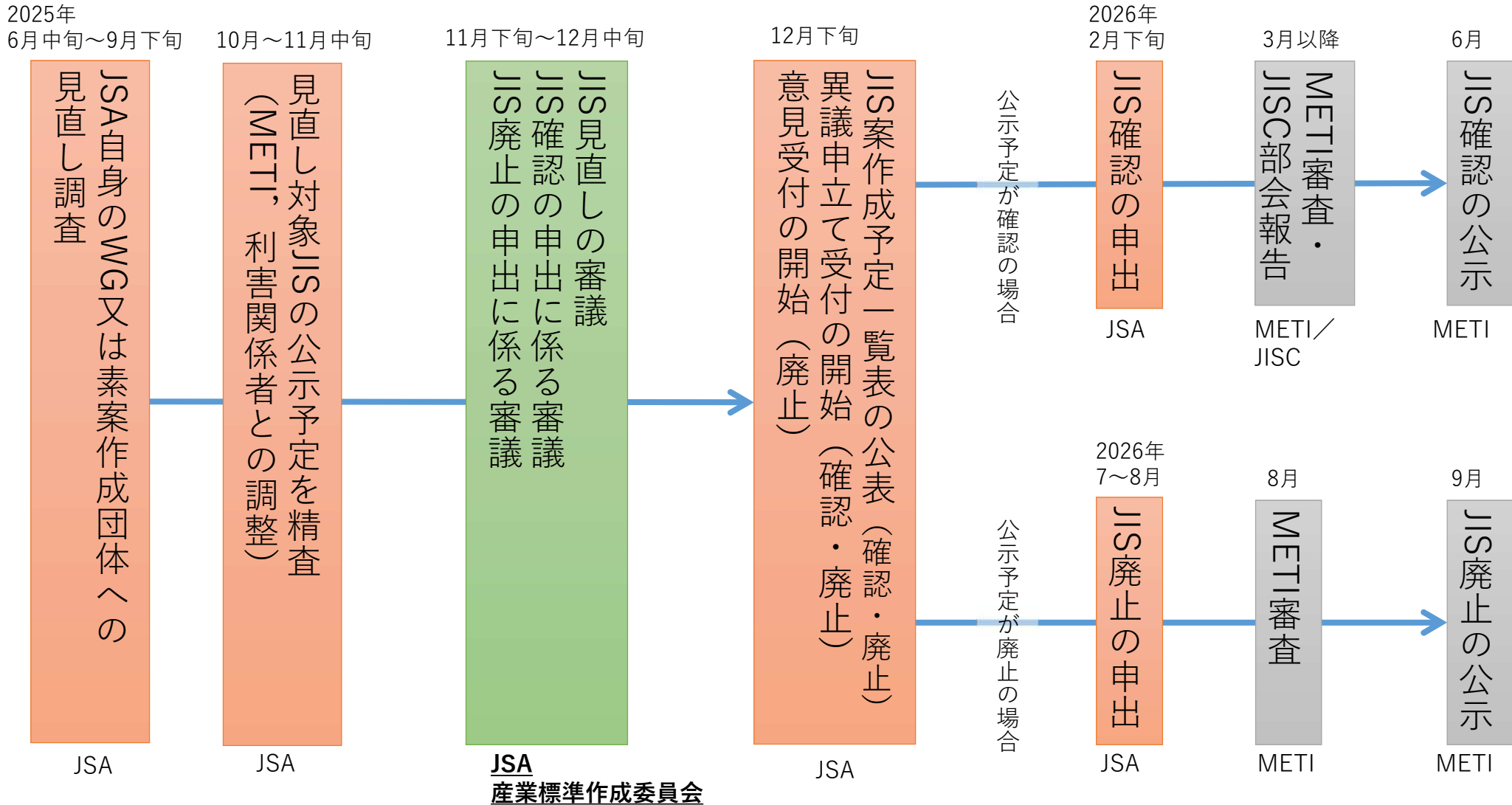
### （２）JIS 確認の申出の審議

上記別添 2 に基づき、別添 3【確認の作成審議経過報告書】に、2026 年度中の公示予定を「確認」とする JIS 及び作成審議経過等を作成いたしました。申出前までに利害関係者からのご意見等がない場合は、公示予定が「確認」について、産業標準化法第 16 条において準用する同法第 14 条第 1 項の規定に基づき、主務大臣に申出してよろしいか、あわせてご審議をお願いいたします。

以上

# 別添1：JISの見直しに関する審議

## (1) JIS見直しの流れ



## (2) JIS見直しの審議について

目的： 次年度に5年見直し期限を迎えるJISについて、「改正」、「確認」又は「廃止」のいずれにするかの見直し方針を決定します。

1. 利害関係者の意見を確認するため、JSAが見直し対象のJISを抽出し、調査します。
  - ※ 見直し対象は、次年度に5年見直し期限を迎えるJISです。
  - ※ 技術的動向、対応国際規格や引用規格の改正・廃止などを背景に、JISを改正する必要があるのか、確認でよいのか、又は廃止するかなどを調査します。

## (2) JIS見直しの審議について (続き)

2. JSAが調査結果に基づき、それぞれのJISについて「改正」、「確認」又は「廃止」のいずれにするかの案（以下、JIS見直し案という。）を理由とともに作成します。

その際には、必要に応じて、JSA自身のWG又は素案作成団体に事実確認を行います。

その後、産業標準作成委員会にお諮りします。

※ 当該JISが次に該当し、次年度までに「改正」又は「廃止」の公示を予定している場合は、JIS見直し案を「改正」又は「廃止」とします。

※ 当該JISが次に該当し、これから改正又は廃止に着手するため、次年度までに「改正」若しくは「廃止」の公示ができない場合、又は次に該当しない場合は、JIS見直し案を「確認」とします。

改正又は廃止が必要な要因
市場実態又は技術動向に合わせ、最適な技術内容とすべく、規定内容の変更が必要
社会的要因で規定内容の変更が必要（環境問題など）
対応国際規格の改正又は廃止があり、規定内容の変更が必要
対応すべき国際規格が新たに制定され、それに整合することが必要
引用規格の改正及び/又は廃止があり、規定内容の変更が必要
引用すべきJISが新たに制定された
引用（参照）法規の改正及び/又は廃止があり、規定内容の変更が必要
引用（参照）すべき法規が新たに制定された
技術の陳腐化・利用の縮小等、JISの廃止が妥当

## (2) JIS見直しの審議について (続き)

3. 産業標準作成委員会でJIS見直し案をご審議いただきます。

### JIS見直し案：【別添2】

- ※ JIS見直し案の資料については、JSAで事実確認を行っております。
- ※ 対応国際規格などの改廃状況は、資料の参照文書（JSA調査結果）に記載しております。
- ※ ご承認いただいたJIS見直しのうち、公示予定が「確認」及び「廃止」のJISは、JIS作成予定一覧表としてJSAホームページに掲載します。  
(利害関係者に対する産業標準作成委員会への参加の機会の確保及び異議申立ての機会の確保のため)

### (3) JIS確認及び廃止の申出に係る審議

目的： 利害関係者の意向を適切に反映するためのプロセスを通し、  
主務大臣にJISの確認及び廃止の申出をしてよいかどうかを決定します。

※廃止方針JISのない分野の産業標準作成委員会では「JIS確認の申出」のみ審議します。  
また、その場合は、2. の【別添4】もございません。

1. JIS見直しの審議と同時に、JSAが作成審議経過報告書（確認及び廃止）（案）を作成します。

※ 当該報告書では、確認及び廃止の申出を行う対象JIS、確認及び廃止する理由、認定機関としてのプロセスの予定（JIS見直しの審議～JIS作成予定一覧表の公表結果（確認及び廃止）（予定）、並びに意見受付公告結果（廃止）（予定））を示しております。

2. 産業標準作成委員会で作成審議経過報告書（確認及び廃止）（案）に基づき、ご審議いただきます。  
作成審議経過報告書：確認【別添3】、廃止【別添4】

3. 審議後、JIS作成予定一覧表の公表（確認及び廃止）及び意見受付公告（廃止）によって、利害関係者の意向を確認します。

※ これによって利害関係者から意見等があった場合で、議決結果の変更又は意見等を採用しない場合は、再度、産業標準作成委員会にお諮りいたします。ただし、意見の提出がない、又は審議の結果に影響を与えない場合は4. 申出へと進みます。

4. 産業標準作成委員会で承認されたJISは、JSAから主務大臣へJISの確認及び廃止の申出を行います。

2026年度に見直し期限を迎えるJISの見直し(案)(電子分野)

別添2

規格番号	規格名称	公示予定 (確認、改正、 廃止又は“-” を入力)	左記理由	対応国際規格との整合	備考	素案作成団体
JIS C 0806-1:2022	自動実装部品の包装—第1部:アキシヤルリード端子部品の連続テープによる包装	確認	対応国際規格が改訂等されていないとともに、技術的な環境変化も生じていないため、確認とする。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技術産業協会
JIS C 2560-2:2006	フェライト磁心—第2部:試験方法	確認	対応国際規格の改訂内容が軽微であり、技術的な環境変化も生じていないため、確認とする。	2: MOD		一般社団法人 電子情報技術産業協会
JIS C 2560-3-1:2006	フェライト磁心—第3-1部:寸法及び外観—E形フェライト磁心	確認	対応国際規格の改訂内容が軽微であり、技術的な環境変化も生じていないため、確認とする。	2: MOD		一般社団法人 電子情報技術産業協会
JIS C 2560-3:2016	フェライト磁心—第3部:寸法及び外観異常	確認	対応国際規格の改訂内容が軽微であり、技術的な環境変化も生じていないため、確認とする。	2: MOD		一般社団法人 電子情報技術産業協会
JIS C 2570-2:2021	直熱形NTCサーミスタ—第2部:品種別通則—表面実装形NTCサーミスタ	確認	対応国際規格が改訂等されていないとともに、技術的な環境変化も生じていないため、確認とする。	2: MOD		一般社団法人 電子情報技術産業協会
JIS C 5101-16:2021	電子機器用固定コンデンサ—第16部:品種別通則:固定メタライズドポリプロピレンフィルム直流通デンサ	確認	対応国際規格が改訂等されていないとともに、技術的な環境変化も生じていないため、確認とする。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技術産業協会
JIS C 5201-1:2021	電子機器用固定抵抗器—第1部:品目別通則	確認	技術的な環境変化が生じていないため、確認とする。ただし、対応国際規格の改訂が予定されており、その動向を踏まえて改正の要否を検討する予定。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技術産業協会
JIS C 5270:2011	電子機器用コンデンサ及び抵抗器—軸操作形部品の操作軸、取付ねじ及び取付孔の形状並びに推奨寸法	確認	対応国際規格が改訂等されていないとともに、技術的な環境変化も生じていないため、確認とする。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技術産業協会
JIS C 5381-12:2021	低圧サージ防護デバイス—第12部:低圧電源システムに接続するサージ防護デバイスの選定及び適用基準	確認	対応国際規格が改訂等されていないとともに、技術的な環境変化も生じていないため、確認とする。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技術産業協会
JIS C 5381-331:2021	低圧サージ防護用部品—第331部:金属酸化物バリスタ(MOV)の要求性能及び試験方法	確認	対応国際規格が改訂等されていないとともに、技術的な環境変化も生じていないため、確認とする。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技術産業協会
JIS C 5402-12-1:2016	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第12-1部:はんだ付け試験—試験12a:はんだ付け性、ぬれ(ウェットニング)、はんだ槽法	確認	対応国際規格が改訂等されていないとともに、技術的な環境変化も生じていないため、確認とする。	2: MOD		一般社団法人 電子情報技術産業協会
JIS C 5402-12-2:2016	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第12-2部:はんだ付け試験—試験12b:はんだ付け性、ぬれ(ウェットニング)、はんだこて法	確認	対応国際規格が改訂等されていないとともに、技術的な環境変化も生じていないため、確認とする。	2: MOD		一般社団法人 電子情報技術産業協会
JIS C 5402-12-4:2016	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第12-4部:はんだ付け試験—試験12d:はんだ耐熱性、はんだ槽法	確認	対応国際規格が改訂等されていないとともに、技術的な環境変化も生じていないため、確認とする。	2: MOD		一般社団法人 電子情報技術産業協会
JIS C 5402-12-5:2016	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第12-5部:はんだ付け試験—試験12e:はんだ耐熱性、はんだこて法	確認	対応国際規格が改訂等されていないとともに、技術的な環境変化も生じていないため、確認とする。	2: MOD		一般社団法人 電子情報技術産業協会
JIS C 5402-22-1:2016	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第22-1部:静電容量試験—試験22a:静電容量	確認	対応国際規格が改訂等されていないとともに、技術的な環境変化も生じていないため、確認とする。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技術産業協会
JIS C 5402-8-2:2016	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第8-2部:静的な力試験(固定形コネクタ)—試験8b:静的な力、軸方向	確認	対応国際規格が改訂等されていないとともに、技術的な環境変化も生じていないため、確認とする。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技術産業協会
JIS C 5445:2021	電子機器用スイッチ—第1部:通則	確認	対応国際規格が改訂等されていないとともに、技術的な環境変化も生じていないため、確認とする。	2: MOD		一般社団法人 日本電気制御機器工業会
JIS C 5504:2016	ホーンスピーカ	確認	(対応国際規格は存在せず)技術的な環境変化が生じていないため、確認とする。	6: 無(提案)対応国際規格が存在せず、今後の対応未定のもの。		一般社団法人 電子情報技術産業協会
JIS C 5630-1:2017	マイクロマシン及びMEMS—第1部:マイクロマシン及びMEMSに関する用語	確認	対応国際規格が改訂等されていないとともに、技術的な環境変化も生じていないため、確認とする。	2: MOD		一般財団法人 マイクロマシンセンター
JIS C 5630-6:2011	マイクロマシン及びMEMS—第6部:薄膜材料の軸荷重疲労試験方法	確認	対応国際規格が改訂等されていないとともに、技術的な環境変化も生じていないため、確認とする。	1: IDT		一般財団法人 マイクロマシンセンター
JIS C 5877-2:2012	偏光子試験方法	確認	(対応国際規格は存在せず)技術的な環境変化が生じていないため、確認とする。	5: 無(提案)対応国際規格が存在せず、国際規格に提案しないもの。		一般財団法人 光産業技術振興協会

【JIS書誌情報】

規格番号及び西暦年	書誌情報		主務大臣	専門委員会	参照文書 (JISA調査結果)		対応国際規格	引用JIS	引用国際規格	参照文書の記号の説明: ◎当該JIS発効時の参照文書のすべてが、改廃されず、 継続している。 ×当該JIS発効時以降、参照文書の一部及び又は全てが、 改廃及び又は廃止されている(現状が不明なものも含む)。 -当該JISに参照文書がない。	対応国際規格	対応国際規格の同 等性	制定年月日	最新改正日
	種類	年月日			対 応 国 際 規 格	引 用 J I S								
	最新公示	年月日												
JIS C 0806-1:2022	改正	2022/2/21	経産	電子・情報技術	◎	◎	◎			IEC 60288-1:2017/AMENDMENT 1:2021	IDT		1999/2/20	2022/02/21
JIS C 2560-2:2006	確認	2021/6/21	経産	電子・情報技術	×	×	◎			IEC 60424-1:1999/IEC 61631:2001/IEC 62044-1:2002/IEC 62044-2:2005/IEC 62044-3:2000	MOD;MOD;MOD;MOD		2006/11/20	
JIS C 2560-3-1:2006	確認	2021/6/21	経産	電子・情報技術	×	-	×			IEC 60424-3:1999/IEC 61185:2005/IEC 61945/CDV/IEC 62317-7:2005	MOD;MOD;MOD;MOD		2006/11/20	
JIS C 2560-3:2016	確認	2021/6/21	経産	電子・情報技術	×	◎	-			IEC 60401-1:2002/IEC 60401-2:2009/IEC 60424-1:2015/IEC 62317-1:2007	MOD;MOD;MOD;MOD		2016/12/20	
JIS C 2570-2:2021	改正	2021/10/20	経産	電子・情報技術	◎	◎	×			IEC 60539-2:2019	MOD		2008/5/20	2021/10/20
JIS C 5101-16:2021	改正	2021/10/20	経産	電子・情報技術	◎	×	×			IEC 60384-16:2019	IDT		1999/2/20	2021/10/20
JIS C 5201-1:2021	改正	2021/10/20	経産	電子・情報技術	◎	×	×			IEC 60115-1:2020	IDT		1998/2/20	2021/10/20
JIS C 5270:2011	確認	2021/6/21	経産	電子・情報技術	◎	-	×			IEC 80915:2006/Technical Corrigendum 1:2008	IDT		2011/8/22	
JIS C 5381-12:2021	改正	2021/10/20	経産	電子・情報技術	◎	×	×			IEC 61643-12:2020	IDT		2004/3/20	2021/10/20
JIS C 5381-331:2021	改正	2021/10/20	経産	電子・情報技術	◎	×	-			IEC 61643-331:2020	IDT		2006/11/20	2021/10/20
JIS C 5402-12-1:2016	確認	2021/6/21	経産	電子・情報技術	◎	×	-			IEC 60512-12-1:2006	MOD		2016/12/20	
JIS C 5402-12-2:2016	確認	2021/6/21	経産	電子・情報技術	◎	×	-			IEC 60512-12-2:2006	MOD		2016/12/20	
JIS C 5402-12-4:2016	確認	2021/6/21	経産	電子・情報技術	◎	×	-			IEC 60512-12-4:2006	MOD		2016/12/20	
JIS C 5402-12-5:2016	確認	2021/6/21	経産	電子・情報技術	◎	×	-			IEC 60512-12-5:2006	MOD		2016/12/20	
JIS C 5402-22-1:2016	確認	2021/6/21	経産	電子・情報技術	◎	-	-			IEC 60512-22-1:2010	IDT		2016/12/20	
JIS C 5402-8-2:2016	確認	2021/6/21	経産	電子・情報技術	◎	◎	-			IEC 60512-8-2:2011	IDT		2016/12/20	
JIS C 5445:2021	改正	2021/5/20	経産	電子・情報技術	◎	×	×			IEC 61020-1:2019	MOD		2012/10/22	2021/05/20
JIS C 5504:2016	確認	2021/6/21	経産	電子・情報技術	-	◎	-						1954/8/18	2016/11/21
JIS C 5630-1:2017	確認	2021/6/21	経産	電子・情報技術	◎	-	-			IEC 62047-1:2016	MOD		2008/3/20	2017/03/21
JIS C 5630-6:2011	確認	2021/6/21	経産	電子・情報技術	◎	◎	-			IEC 62047-6:2009	IDT		2011/8/22	
JIS C 5877-2:2012	確認	2021/6/21	経産	電子・情報技術	-	×	-						2012/1/20	

2026年度に見直し期限を迎えるJISの見直し(案)(電子分野)

別添2

規格番号	規格名称	公示予定 (確認、改正、 廃止又は“—” を入力)	左記理由	対応国際規格との整合	備考	素案作成団体
JIS C 5914-3:2017	光伝送用サーキュレーター第3部:シングルモードファイバビッグテール形光サーキュレーター	確認	改正を検討中だが、当該規格に係る実質的な利害関係を有する全ての者の意向を反映するための調整等に時間が必要であり、改正公示となるのが再来年度以降となる見込みのため、確認とする。	2: MOD		一般財団法人 光産業技術振興 協会
JIS C 5920-3:2017	光伝送用パワー制御受動部品—第3部:シングルモードファイバビッグテール形電気制御式可変光減衰器	確認	改正を検討中だが、当該規格に係る実質的な利害関係を有する全ての者の意向を反映するための調整等に時間が必要であり、改正公示となるのが再来年度以降となる見込みのため、確認とする。	2: MOD		一般財団法人 光産業技術振興 協会
JIS C 5948:2017	光伝送用半導体レーザモジュールの信頼性評価方法	確認	対応国際規格が改訂等されていないとともに、技術的な環境変化も生じていないため、確認とする。	2: MOD		一般財団法人 光産業技術振興 協会
JIS C 5953-1:2016	光伝送用能動部品—性能標準—第1部:総則	確認	対応国際規格が改訂等されていないとともに、技術的な環境変化も生じていないため、確認とする。	1: IDT		一般財団法人 光産業技術振興 協会
JIS C 5953-7:2017	光伝送用能動部品—性能標準—第7部:GPON用光トランシーバ	確認	改正を検討中だが、当該規格に係る実質的な利害関係を有する全ての者の意向を反映するための調整等に時間が必要であり、改正公示となるのが再来年度以降となる見込みのため、確認とする。	5: 無(提無)対応国際規格が存在せず、国際規格に提案しないもの。		一般財団法人 光産業技術振興 協会
JIS C 5954-4:2017	光伝送用能動部品—試験及び測定方法—第4部:GPON用光トランシーバ	確認	(対応国際規格は存在せず)技術的な環境変化が生じていないため、確認とする。	5: 無(提無)対応国際規格が存在せず、国際規格に提案しないもの。		一般財団法人 光産業技術振興 協会
JIS C 5955-1:2016	光伝送用能動部品—性能標準—第1部:単心直列伝送リンク用光送・受信モジュール	確認	(対応国際規格は存在せず)技術的な環境変化が生じていないため、確認とする。	5: 無(提無)対応国際規格が存在せず、国際規格に提案しないもの。		一般財団法人 光産業技術振興 協会
JIS C 5965-2-4:2016	光ファイバコネクタ光学互換標準—第2-4部:基準接続用シングルモード直角PC端面光ファイバの接続パラメータ	確認	技術的な環境変化が生じていないため、確認とする。ただし、対応国際規格の改訂が予定されており、その動向を踏まえて改正の要否を検討する予定。	1: IDT		一般財団法人 光産業技術振興 協会
JIS C 5965-2-5:2016	光ファイバコネクタ光学互換標準—第2-5部:基準接続用シングルモード斜めPC端面光ファイバの接続パラメータ	確認	改正を検討中だが、当該規格に係る実質的な利害関係を有する全ての者の意向を反映するための調整等に時間が必要であり、改正公示となるのが再来年度以降となる見込みのため、確認とする。	1: IDT		一般財団法人 光産業技術振興 協会
JIS C 5965-3-1:2011	光ファイバコネクタ光学互換—第3-1部:シングルモードファイバ用直径2.5mm及び1.25mm円筒形全ジルコニア直角PC端面フェルル光学互換標準	改正	対応国際規格が改訂されているとともに、技術的な環境変化が生じているため、改正する。	1: IDT		一般財団法人 光産業技術振興 協会
JIS C 5965-3-2:2011	光ファイバコネクタ光学互換—第3-2部:シングルモードファイバ用直径2.5mm及び1.25mm円筒形全ジルコニア8度斜めPC端面フェルル光学互換標準	改正	対応国際規格が改訂されているとともに、技術的な環境変化が生じているため、改正する。	1: IDT		一般財団法人 光産業技術振興 協会
JIS C 6010-1:2021	電気及び電子機器実装の機械的構造 開発のためのモジュラーオーダー—第1部:基準規格	確認	対応国際規格が改訂等されていないとともに、技術的な環境変化も生じていないため、確認とする。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技術産 業協会
JIS C 6101-2:1998	テレビジョン受信機試験方法 第2部:音声チャンネルモノラルチャンネルの電気的測定と一般的方法	確認	対応国際規格が改訂等されていないとともに、技術的な環境変化も生じていないため、確認とする。	2: MOD		一般社団法人 電子情報技術産 業協会
JIS C 6101-3:1998	テレビジョン受信機試験方法 第3部:副搬送波方式使用の音声多重テレビジョン受信機の電気的測定	確認	対応国際規格が改訂等されていないとともに、技術的な環境変化も生じていないため、確認とする。	2: MOD		一般社団法人 電子情報技術産 業協会
JIS C 61191-6:2011	プリント配線板実装—第6部:BGA及びLGAのはんだ接合部のボイド評価基準及び測定方法	確認	対応国際規格が改訂等されていないとともに、技術的な環境変化も生じていないため、確認とする。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技術産 業協会
JIS C 6121-1:2021	光増幅器—第1部:通則	確認	対応国際規格が改訂等されていないとともに、技術的な環境変化も生じていないため、確認とする。	1: IDT		一般財団法人 光産業技術振興 協会
JIS C 6122-10-3:2012	光増幅器—測定方法—第10-3部:マルチチャンネルパラメータ—プローブ法	確認	対応国際規格が改訂等されていないとともに、技術的な環境変化も生じていないため、確認とする。	1: IDT		一般財団法人 光産業技術振興 協会
JIS C 6122-10-5:2022	光増幅器—測定方法—第10-5部:マルチチャンネルパラメータ—分布ラマン増幅器の利得及び雑音指数	確認	対応国際規格が改訂等されていないとともに、技術的な環境変化も生じていないため、確認とする。	1: IDT		一般財団法人 光産業技術振興 協会
JIS C 6122-3-1:2011	光増幅器—測定方法—第3-1部:雑音指数パラメータ—光スペクトラムアナライザ法	確認	対応国際規格が改訂等されていないとともに、技術的な環境変化も生じていないため、確認とする。	1: IDT		一般財団法人 光産業技術振興 協会
JIS C 6122-3-3:2016	光増幅器—測定方法—第3-3部:雑音指数パラメータ—信号対総ASEパワー比	確認	対応国際規格が改訂等されていないとともに、技術的な環境変化も生じていないため、確認とする。	1: IDT		一般財団法人 光産業技術振興 協会

【JIS書誌情報】

規格番号及び西暦年	最新公示		主務大臣	専門委員会	参照文書 (JISA調査結果)			対応国際規格	引用JIS	引用国際規格	対応国際規格	対応国際規格の同等性	制定年月日	最新改正日
	種類	年月日			対応国際規格	引用JIS	引用国際規格							
JIS C 5914-3:2017	確認	2021/6/21	経産	電子・情報技術	×	×	◎				IEC 61753-091-2:2012	MOD	2017/3/21	
JIS C 5920-3:2017	確認	2021/6/21	経産	電子・情報技術	×	×	◎				IEC 61753-053-2:2014	MOD	2017/3/21	
JIS C 5948:2017	確認	2021/6/21	経産	電子・情報技術	◎	◎	—				IEC 62572-3:2016	MOD	2007/3/20	2017/03/21
JIS C 5953-1:2016	確認	2021/6/21	経産	電子・情報技術	◎	×	×				IEC 62149-1:2011	IDT	2007/3/20	2016/05/20
JIS C 5953-7:2017	確認	2021/6/21	経産	電子・情報技術	—	×	×							2017/3/21
JIS C 5954-4:2017	確認	2021/6/21	経産	電子・情報技術	—	◎	—							2017/3/21
JIS C 5955-1:2016	確認	2021/6/21	経産	電子・情報技術	—	×	×							2016/12/20
JIS C 5965-2-4:2016	確認	2021/6/21	経産	電子・情報技術	◎	×	×				IEC 61755-2-4:2015	IDT	2016/11/21	
JIS C 5965-2-5:2016	確認	2021/6/21	経産	電子・情報技術	◎	×	×				IEC 61755-2-5:2015	IDT	2016/11/21	
JIS C 5965-3-1:2011	確認	2021/6/21	経産	電子・情報技術	×	×	×				IEC 61755-3-1:2008	IDT	2011/10/20	
JIS C 5965-3-2:2011	確認	2021/6/21	経産	電子・情報技術	×	×	×				IEC 61755-3-2:2008	IDT	2011/10/20	
JIS C 6010-1:2021	改正	2021/9/21	経産	電子・情報技術	◎	×	×				IEC 60917-1:2019	IDT	1998/10/20	2021/09/21
JIS C 6101-2:1998	確認	2021/6/21	経産	電子・情報技術	◎	×	×				IEC 60107-2:1997	MOD	1998/12/20	
JIS C 6101-3:1998	確認	2021/6/21	経産	電子・情報技術	◎	—	—				IEC 60107-3:1998	MOD	1998/12/20	
JIS C 61191-6:2011	確認	2021/6/21	経産	電子・情報技術	◎	×	—				IEC 61191-6:2010	IDT	2011/12/20	
JIS C 6121-1:2021	制定	2021/5/20	経産	電子・情報技術	◎	×	×				IEC 61291-1:2018	IDT	2021/5/20	
JIS C 6122-10-3:2012	確認	2021/6/21	経産	電子・情報技術	◎	×	—				IEC 61290-10-3:2002	IDT	2012/1/20	
JIS C 6122-10-5:2022	改正	2022/2/21	経産	電子・情報技術	◎	◎	—				IEC 61290-10-5:2014	IDT	2016/5/20	2022/02/21
JIS C 6122-3-1:2011	確認	2021/6/21	経産	電子・情報技術	◎	×	—				IEC 61290-3-1:2003	IDT	2011/10/20	
JIS C 6122-3-3:2016	確認	2021/6/21	経産	電子・情報技術	◎	×	—				IEC 61290-3-3:2013	IDT	2016/5/20	

参照文書の記号の説明:  
◎当該JIS発効時の参照文書のすべてが、改廃されずに、  
継続している。  
×当該JIS発効時以降、参照文書の一部及び又は全てが、  
改正及び又は廃止されている(現状が不明なものも含む)。  
—当該JISに参照文書がない。

2026年度に見直し期限を迎えるJISの見直し(案) (電子分野)

別添2

規格番号	規格名称	公示予定 (確認、改正、 廃止又は“ニ” を入力)	左記理由	対応国際規格との整合	備考	素案作成団体
JIS C 61280-1-3:2017	光ファイバ通信サブシステム試験方法—第1—3部:中心波長及びスペクトル幅測定	確認	改正を検討中だが、当該規格に係る実質的な利害関係を有する全ての者の意向を反映するための調整等に時間が必要であり、改正公示となるのが再来年度以降となる見込みのため、確認とする。	1: IDT		一般財団法人 光産業技術振興協会
JIS C 61280-1-4:2022	光ファイバ通信サブシステム試験方法—第1—4部:一般通信サブシステム—光源エンサードフラックス測定	確認	改正を検討中だが、当該規格に係る実質的な利害関係を有する全ての者の意向を反映するための調整等に時間が必要であり、改正公示となるのが再来年度以降となる見込みのため、確認とする。	1: IDT		一般財団法人 光産業技術振興協会
JIS C 61280-2-10:2012	光ファイバ通信サブシステム試験方法—第2—10部:レーザ送信器の時間分解チャープ及びアルファファクタ測定	確認	対応国際規格が改訂等されていないとともに、技術的な環境変化も生じていないため、確認とする。	1: IDT		一般財団法人 光産業技術振興協会
JIS C 61280-2-2:2017	光ファイバ通信サブシステム試験方法—第2—2部:光アイパターン、光波形及び消光比測定	確認	対応国際規格が改訂等されていないとともに、技術的な環境変化も生じていないため、確認とする。	1: IDT		一般財団法人 光産業技術振興協会
JIS C 61281-1:2021	光ファイバ通信サブシステム—第1部:通則	確認	対応国際規格が改訂等されていないとともに、技術的な環境変化も生じていないため、確認とする。	1: IDT		一般財団法人 光産業技術振興協会
JIS C 61300-2-22:2012	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第2—22部:温度サイクル試験	確認	改正を検討中だが、当該規格に係る実質的な利害関係を有する全ての者の意向を反映するための調整等に時間が必要であり、改正公示となるのが再来年度以降となる見込みのため、確認とする。	1: IDT		一般財団法人 光産業技術振興協会
JIS C 61300-2-47:2012	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第2—47部:熱衝撃試験	確認	対応国際規格が改訂内容が軽微であり、技術的な環境変化も生じていないため、確認とする。	2: MOD		一般財団法人 光産業技術振興協会
JIS C 61300-2-49:2016	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第2—49部:取付け済み光ファイバコード付きファイバコネクタプラグの曲げ試験	確認	対応国際規格が改訂等されていないとともに、技術的な環境変化も生じていないため、確認とする。	1: IDT		一般財団法人 光産業技術振興協会
JIS C 61300-2-50:2016	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第2—50部:光ファイバクランプ強度試験—非通光左右曲げ引張り	確認	対応国際規格が改訂等されていないとともに、技術的な環境変化も生じていないため、確認とする。	1: IDT		一般財団法人 光産業技術振興協会
JIS C 61300-2-51:2016	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第2—51部:光ファイバクランプ強度試験—通光左右曲げ引張り	確認	対応国際規格が改訂等されていないとともに、技術的な環境変化も生じていないため、確認とする。	1: IDT		一般財団法人 光産業技術振興協会
JIS C 61300-3-14:2016	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第3—14部:可変光減衰器の減衰量の設定の誤差及び再現性測定	確認	対応国際規格が改訂等されていないとともに、技術的な環境変化も生じていないため、確認とする。	1: IDT		一般財団法人 光産業技術振興協会
JIS C 61300-3-2:2012	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第3—2部:シングルモード光デバイスの光損失の偏光依存性	確認	対応国際規格が改訂等されていないとともに、技術的な環境変化も生じていないため、確認とする。	2: MOD		一般財団法人 光産業技術振興協会
JIS C 61300-3-47:2016	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第3—47部:干渉法による直角PC端面及び斜めPC端面単心円筒形フェルールの端面形状測定	確認	対応国際規格が改訂等されていないとともに、技術的な環境変化も生じていないため、確認とする。	1: IDT		一般財団法人 光産業技術振興協会
JIS C 61760-4:2021	表面実装技術—第4部:感湿性部品の分類、包装、表示及び取扱い	確認	技術的な環境変化が生じていないため、確認とする。ただし、対応国際規格の改訂が予定されており、その動向を踏まえて改正の要否を検討する予定。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技術産業協会
JIS C 6185-1:2017	オプティカルタイムドメインリフレクトメータ(OTDR)—第1部:試験方法	確認	(対応国際規格は存在せず)技術的な環境変化が生じていないため、確認とする。	5: 無(提無)対応国際規格が存在せず、国際規格に提案しないもの。		一般財団法人 光産業技術振興協会
JIS C 6187-1:2016	光波長計—第1部:試験方法	確認	(対応国際規格は存在せず)技術的な環境変化が生じていないため、確認とする。	5: 無(提無)対応国際規格が存在せず、国際規格に提案しないもの。		一般財団法人 光産業技術振興協会
JIS C 6188:2021	測定用光減衰器校正方法	確認	(対応国際規格は存在せず)技術的な環境変化が生じていないため、確認とする。	5: 無(提無)対応国際規格が存在せず、国際規格に提案しないもの。		一般財団法人 光産業技術振興協会
JIS C 6189:2022	光反射減衰量測定器試験方法	確認	(対応国際規格は存在せず)技術的な環境変化が生じていないため、確認とする。	5: 無(提無)対応国際規格が存在せず、国際規格に提案しないもの。		一般財団法人 光産業技術振興協会
JIS C 62137-1-3:2011	表面実装技術—はんだ接合部耐久性試験方法—第1—3部:繰返し落下試験方法	確認	対応国際規格が改訂等されていないとともに、技術的な環境変化も生じていないため、確認とする。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技術産業協会
JIS C 62137-1-4:2011	表面実装技術—はんだ接合部耐久性試験方法—第1—4部:繰返し曲げ試験方法	確認	対応国際規格が改訂等されていないとともに、技術的な環境変化も生じていないため、確認とする。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技術産業協会
JIS C 62137-1-5:2011	表面実装技術—はんだ接合部耐久性試験方法—第1—5部:せん断疲労試験方法	確認	対応国際規格が改訂等されていないとともに、技術的な環境変化も生じていないため、確認とする。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技術産業協会

【JIS書誌情報】

規格番号及び西暦年	最新公示		主務大臣	専門委員会	参照文書 (JSA調査結果)			対応国際規格	引用JIS	引用国際規格	対応国際規格	対応国際規格の同等性	制定年月日	最新改正日
	種類	年月日			対国際規格	引用JIS	引用国際規格							
	種類	年月日	対国際規格	引用JIS	引用国際規格									
JIS C 61280-1-3:2017	確認	2021/6/21	経産	電子・情報技術	×	×	-				IEC 61280-1-3:2010	IDT	2010/5/20	2017/03/21
JIS C 61280-1-4:2022	制定	2022/3/22	経産	電子・情報技術	×	◎	×				IEC 61280-1-4:2009	IDT	2022/3/22	
JIS C 61280-2-10:2012	確認	2021/6/21	経産	電子・情報技術	◎	-	-				IEC 61280-2-10:2005	IDT	2012/1/20	
JIS C 61280-2-2:2017	確認	2021/6/21	経産	電子・情報技術	◎	◎	-				IEC 61280-2-2:2011/CORRIGENDUM 1:2015	IDT	2010/5/20	2017/03/21
JIS C 61281-1:2021	改正	2021/9/21	経産	電子・情報技術	◎	-	-				IEC 61281-1:2017	IDT	2010/5/20	2021/09/21
JIS C 61300-2-22:2012	確認	2021/6/21	経産	電子・情報技術	×	×	-				IEC 61300-2-22:2007	IDT	2012/1/20	
JIS C 61300-2-47:2012	確認	2021/6/21	経産	電子・情報技術	×	×	◎				IEC 61300-2-47:2010	MOD	2012/1/20	
JIS C 61300-2-49:2016	確認	2021/6/21	経産	電子・情報技術	◎	×	-				IEC 61300-2-49:2007	IDT	2016/6/20	
JIS C 61300-2-50:2016	確認	2021/6/21	経産	電子・情報技術	◎	×	-				IEC 61300-2-50:2007/TECHNICAL CORRIGENDUM 1:2015	IDT	2016/6/20	
JIS C 61300-2-51:2016	確認	2021/6/21	経産	電子・情報技術	◎	×	-				IEC 61300-2-51:2007/TECHNICAL CORRIGENDUM 1:2015	IDT	2016/6/20	
JIS C 61300-3-14:2016	確認	2021/6/21	経産	電子・情報技術	◎	×	-				IEC 61300-3-14:2014	IDT	2016/6/20	
JIS C 61300-3-2:2012	確認	2021/6/21	経産	電子・情報技術	◎	-	×				IEC 61300-3-2:2009	MOD	2012/1/20	
JIS C 61300-3-47:2016	確認	2021/6/21	経産	電子・情報技術	◎	-	-				IEC 61300-3-47:2014	IDT	2016/12/20	
JIS C 61760-4:2021	改正	2021/10/20	経産	電子・情報技術	◎	×	×				IEC 61760-4:2015/AMENDMENT 1:2018	IDT	2016/12/20	2021/10/20
JIS C 6185-1:2017	確認	2021/6/21	経産	電子・情報技術	-	×	×						2017/3/21	
JIS C 6187-1:2016	確認	2021/6/21	経産	電子・情報技術	-	×	×						2016/5/20	
JIS C 6188:2021	改正	2021/9/21	経産	電子・情報技術	-	×	×						1999/7/20	2021/09/21
JIS C 6189:2022	改正	2022/2/21	経産	電子・情報技術	-	×	×						2004/3/20	2022/02/21
JIS C 62137-1-3:2011	確認	2021/6/21	経産	電子・情報技術	◎	×	×				IEC 62137-1-3:2008	IDT	2011/12/20	
JIS C 62137-1-4:2011	確認	2021/6/21	経産	電子・情報技術	◎	×	×				IEC 62137-1-4:2009	IDT	2011/12/20	
JIS C 62137-1-5:2011	確認	2021/6/21	経産	電子・情報技術	◎	×	×				IEC 62137-1-5:2009	IDT	2011/12/20	

参照文書の記号の説明:  
 ◎ 当該JIS発効時の参照文書のすべてが、改廃されずに、  
 継続している。  
 × 当該JIS発効時以降、参照文書の一部及び/又は全てが、  
 改正及び/又は廃止されている(現状が不明なものを含む)。  
 - 当該JISに参照文書がない。

2026年度に見直し期限を迎えるJISの見直し(案)(電子分野)

別添2

規格番号	規格名称	公示予定 (確認、改正、 廃止又は“—” を入力)	左記理由	対応国際規格との整合	備考	素案作成団体
JIS C 62246-1-1:2016	リードスイッチ—第1—1部:品質評価及び試験方法	確認	対応国際規格の改訂内容が軽微であり、技術的な環境変化も生じていないため、確認とする。	2: MOD		一般社団法人 日本電気制御機器工業会
JIS C 62246-1:2016	リードスイッチ—第1部:品目別通則	確認	対応国際規格が改訂等されていないとともに、技術的な環境変化も生じていないため、確認とする。	1: IDT		一般社団法人 日本電気制御機器工業会
JIS C 62610-2:2021	電気及び電子装置用の機械的構造—屋内キャビネットの熱管理—第2部:強制空冷構造の決定方法	確認	対応国際規格が改訂等されていないとともに、技術的な環境変化も生じていないため、確認とする。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技術産業協会
JIS C 62610-5:2021	電気及び電子装置用の機械的構造—屋内キャビネットの熱管理—第5部:屋内キャビネットの冷却性能	確認	対応国際規格が改訂等されていないとともに、技術的な環境変化も生じていないため、確認とする。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技術産業協会
JIS C 62610-6:2021	電気及び電子装置用の機械的構造—屋内キャビネットの熱管理—第6部:屋内キャビネットのエア再循環及びバイパス	確認	対応国際規格が改訂等されていないとともに、技術的な環境変化も生じていないため、確認とする。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技術産業協会
JIS C 62813:2016	電気・電子機器用リチウムイオンキャパシタ—電気的特性の試験方法	改正	対応国際規格が改訂されているとともに、技術的な環境変化が生じているため、改正する。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技術産業協会
JIS C 6803:2022	レーザ製品の安全—光ファイバ通信システムの安全	確認	技術的な環境変化が生じていないため、確認とする。ただし、対応国際規格の改訂が予定されており、その動向を踏まえて改正の要否を検討する予定。	1: IDT		一般財団法人 光産業技術振興協会
JIS C 6804:2022	レーザ製品の安全—情報伝送のための光無線通信システムの安全	改正	対応国際規格が改訂されているとともに、技術的な環境変化が生じているため、改正する。	1: IDT		一般財団法人 光産業技術振興協会
JIS C 6821:2022	光ファイバ機械特性試験方法	確認	対応国際規格が改訂等されていないとともに、技術的な環境変化も生じていないため、確認とする。	2: MOD		一般財団法人 光産業技術振興協会
JIS C 6837:2022	全プラスチックマルチモード光ファイバ素線	確認	対応国際規格が改訂等されていないとともに、技術的な環境変化も生じていないため、確認とする。	2: MOD		一般財団法人 光産業技術振興協会
JIS C 6870-2-30:2022	光ファイバケーブル—第2—30部:屋内ケーブル—終端ケーブルアセンブリに使用するテーブ形光ファイバコード品種別通則	確認	対応国際規格が改訂等されていないとともに、技術的な環境変化も生じていないため、確認とする。	2: MOD		一般財団法人 光産業技術振興協会
JIS C 6872:2022	光ファイバ—測定方法及び試験手順—ビート長	確認	対応国際規格が改訂等されていないとともに、技術的な環境変化も生じていないため、確認とする。	1: IDT		一般財団法人 光産業技術振興協会

【JIS書誌情報】

規格番号及び西暦年	書誌情報		主務大臣	専門委員会	参照文書 (JISA調査結果)		対応国際規格	引用JIS	引用国際規格	対応国際規格	対応国際規格の同等性	制定年月日	最新改正日
	種類	年月日			対国際規格	引用規格							
JIS C 62246-1-1:2016	確認	2021/6/21	経産	電気技術	×	×	—			IEC 62246-1-1:2013	MOD	2016/6/20	
JIS C 62246-1:2016	確認	2021/6/21	経産	電気技術	◎	×	—			IEC 62246-1:2015	IDT	2016/6/20	
JIS C 62610-2:2021	制定	2021/9/21	経産	電子・情報技術	◎	◎	—			IEC 62610-2:2018	IDT	2021/9/21	
JIS C 62610-5:2021	制定	2021/9/21	経産	電子・情報技術	◎	—	—			IEC 62610-5:2016	IDT	2021/9/21	
JIS C 62610-6:2021	制定	2021/9/21	経産	電子・情報技術	◎	◎	—			IEC 62610-6:2020	IDT	2021/9/21	
JIS C 62813:2016	確認	2021/6/21	経産	電子・情報技術	×	◎	—			IEC 62813:2015	IDT	2016/12/20	
JIS C 6803:2022	改正	2022/3/22	経産	電子・情報技術	◎	◎	—			IEC 60825-2:2021	IDT	2006/1/20	2022/03/22
JIS C 6804:2022	改正	2022/3/22	経産	電子・情報技術	×	◎	—			IEC 60825-12:2019	IDT	2008/10/20	2022/03/22
JIS C 6821:2022	改正	2022/2/21	経産	電子・情報技術	◎	×	◎			IEC 60793-1-30:2010;IEC 60793-1-31:2019;IEC 60793-1-32:2018;IEC 60793-1-33:2017;IEC 60793-1-	MOD;MOD;MOD;MOD;MOD	1989/1/1	2022/02/21
JIS C 6837:2022	改正	2022/2/21	経産	電子・情報技術	◎	×	◎			IEC 60793-2-40:2021	MOD	1992/9/1	2022/02/21
JIS C 6870-2-30:2022	制定	2022/2/21	経産	電子・情報技術	◎	×	◎			IEC 60794-2-30:2019	MOD	2022/2/21	
JIS C 6872:2022	改正	2022/2/21	経産	電子・情報技術	◎	×	—			IEC 60793-1-60:2017	IDT	2008/10/20	2022/02/21

参照文書の記号の説明：  
 ◎当該JIS発効時の参照文書のすべてが、改廃されずに、  
 継続している。  
 ×当該JIS発効時以降、参照文書の一部及び/又は全てが、  
 改正及び/又は廃止されている（現状が不明なものも含む）。  
 —当該JISに参照文書がない。

日本産業規格作成審議経過報告書（確認）

**1. 確認の申出を行う日本産業規格**

JIS C 0806-1 自動実装部品の包装—第 1 部：アキシャルリード線端子部品の連続テープによる包装 外 69 件（別紙 1 のとおり）

**2. 確認の申出を行う日本産業規格に係る主務大臣**

経済産業大臣専管

**3. 確認の理由**

別紙 1 の日本産業規格は、産業標準化法第 17 条の規定による見直し期限を 2026 年度に迎えるものであるが、認定産業標準作成機関として、関係各方面の意見を調査し検討した結果、現行の日本産業規格がなお適正であると認められることから、確認すべきものとして申出する。

**4. 確認の申出を行う日本産業規格の作成及び審議に関する事項**

(1) 認定産業標準作成機関名；一般財団法人日本規格協会（JSA）

(2) 法令上の区分；

産業標準化法第 16 条において準用する同法第 14 条第 1 項に基づく申出

(3) 産業標準作成委員会名；

電子分野産業標準作成委員会

(4) 産業標準作成委員会の委員構成表及び開催状況；

別紙 2 に記載のとおり。

(5) 作成審議経過

別紙 2 に記載のとおり。

以上

## 確認の申出を行う日本産業規格

No.	規格番号	規格名称
1	C0806-1	自動実装部品の包装—第1部：アキシヤルリード線端子部品の連続テープによる包装
2	C2560-2	フェライト磁心—第2部：試験方法
3	C2560-3-1	フェライト磁心—第3-1部：寸法及び外観—E形フェライト磁心
4	C2560-3	フェライト磁心—第3部：寸法及び外観異常
5	C2570-2	直熱形NTCサーミスタ—第2部：品種別通則—表面実装形NTCサーミスタ
6	C5101-16	電子機器用固定コンデンサ—第16部：品種別通則：固定メタライズドポリプロピレンフィルム直流コンデンサ
7	C5201-1	電子機器用固定抵抗器—第1部：品目別通則
8	C5270	電子機器用コンデンサ及び抵抗器—軸操作形部品の操作軸、取付ねじ及び取付孔の形状並びに推奨寸法
9	C5381-12	低圧サージ防護デバイス—第12部：低圧電源システムに接続するサージ防護デバイスの選定及び適用基準
10	C5381-331	低圧サージ防護用部品—第331部：金属酸化物バリスタ（MOV）の要求性能及び試験方法
11	C5402-12-1	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第12-1部：はんだ付け試験—試験12a：はんだ付け性、ぬれ（ウェットティング）、はんだ槽法
12	C5402-12-2	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第12-2部：はんだ付け試験—試験12b：はんだ付け性、ぬれ（ウェットティング）、はんだこて法
13	C5402-12-4	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第12-4部：はんだ付け試験—試験12d：はんだ耐熱性、はんだ槽法
14	C5402-12-5	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第12-5部：はんだ付け試験—試験12e：はんだ耐熱性、はんだこて法
15	C5402-22-1	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第22-1部：静電容量試験—試験22a：静電容量
16	C5402-8-2	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第8-2部：静的な力試験（固定形コネクタ）—試験8b：静的な力、軸方向
17	C5445	電子機器用スイッチ—第1部：通則
18	C5504	ホーンスピーカ
19	C5630-1	マイクロマシン及びMEMS—第1部：マイクロマシン及びMEMSに関する用語
20	C5630-6	マイクロマシン及びMEMS—第6部：薄膜材料の軸荷重疲労試験方法
21	C5877-2	偏光子試験方法
22	C5914-3	光伝送用サーキュレータ—第3部：シングルモード光ファイバピグテール形光サーキュレータ
23	C5920-3	光伝送用パワー制御受動部品—第3部：シングルモード光ファイバピグテール形電気制御式可変光減衰器
24	C5948	光伝送用半導体レーザモジュールの信頼性評価方法
25	C5953-1	光伝送用能動部品—性能標準—第1部：総則
26	C5953-7	光伝送用能動部品—性能標準—第7部：GPON用光トランシーバ
27	C5954-4	光伝送用能動部品—試験及び測定方法—第4部：GPON用光トランシーバ
28	C5955-1	光伝送用能動部品—性能標準テンプレート—第1部：単心直列伝送リンク用光送・受信モジュール

29	C5965-2-4	光ファイバコネクタ光学互換標準—第2-4部：基準接続用シングルモード直角PC端面光ファイバの接続パラメータ
30	C5965-2-5	光ファイバコネクタ光学互換標準—第2-5部：基準接続用シングルモード斜めPC端面光ファイバの接続パラメータ
31	C6010-1	電気及び電子機器実装の機械的構造 開発のためのモジュラーオーダー—第1部：基準規格
32	C6101-2	テレビジョン受信機試験方法 第2部：音声チャンネル—モノラルチャンネルの電氣的測定と一般的方法
33	C6101-3	テレビジョン受信機試験方法 第3部：副搬送波方式使用の音声多重テレビジョン受信機の電氣的測定
34	C61191-6	プリント配線板実装—第6部：BGA及びLGAのはんだ接合部のボイド評価基準及び測定方法
35	C6121-1	光増幅器—第1部：通則
36	C6122-10-3	光増幅器—測定方法—第10-3部：マルチチャンネルパラメータ—プローブ法
37	C6122-10-5	光増幅器—測定方法—第10-5部：マルチチャンネルパラメータ—分布ラマン増幅器の利得及び雑音指数
38	C6122-3-1	光増幅器—測定方法—第3-1部：雑音指数パラメータ—光スペクトラムアナライザ法
39	C6122-3-3	光増幅器—測定方法—第3-3部：雑音指数パラメータ—信号対総ASEパワー比
40	C61280-1-3	光ファイバ通信サブシステム試験方法—第1-3部：中心波長及びスペクトル幅測定
41	C61280-1-4	光ファイバ通信サブシステム試験方法—第1-4部：一般通信サブシステム—光源エンサークルドフラックス測定
42	C61280-2-10	光ファイバ通信サブシステム試験方法—第2-10部：レーザ送信器の時間分解チャープ及びアルファファクタ測定
43	C61280-2-2	光ファイバ通信サブシステム試験方法—第2-2部：光アイパターン、光波形及び消光比測定
44	C61281-1	光ファイバ通信サブシステム—第1部：通則
45	C61300-2-22	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第2-22部：温度サイクル試験
46	C61300-2-47	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第2-47部：熱衝撃試験
47	C61300-2-49	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第2-49部：取付け済み光ファイバコード付き光ファイバコネクタプラグの曲げ試験
48	C61300-2-50	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第2-50部：光ファイバクランプ強度試験—非通光左右曲げ引張り
49	C61300-2-51	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第2-51部：光ファイバクランプ強度試験—通光左右曲げ引張り
50	C61300-3-14	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第3-14部：可変光減衰器の減衰量の設定の誤差及び再現性測定
51	C61300-3-2	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第3-2部：シングルモード光デバイスの光損失の偏光依存性
52	C61300-3-47	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第3-47部：干渉法による直角PC端面及び斜めPC端面単心円筒形フェルールの端面形状測定
53	C61760-4	表面実装技術—第4部：感湿性部品の分類、包装、表示及び取扱い
54	C6185-1	オプティカルタイムドメインリフレクトメータ(OTDR)—第1部：試験方法
55	C6187-1	光波長計—第1部：試験方法
56	C6188	測定用光減衰器校正方法

57	C6189	光反射減衰量測定器試験方法
58	C62137-1-3	表面実装技術—はんだ接合部耐久性試験方法—第1-3部：繰返し落下試験方法
59	C62137-1-4	表面実装技術—はんだ接合部耐久性試験方法—第1-4部：繰返し曲げ試験方法
60	C62137-1-5	表面実装技術—はんだ接合部耐久性試験方法—第1-5部：せん断疲労試験方法
61	C62246-1-1	リードスイッチ—第1-1部：品質評価及び試験方法
62	C62246-1	リードスイッチ—第1部：品目別通則
63	C62610-2	電気及び電子装置用の機械的構造—屋内キャビネットの熱管理—第2部：強制空冷構造の決定方法
64	C62610-5	電気及び電子装置用の機械的構造—屋内キャビネットの熱管理—第5部：屋内キャビネットの冷却性能
65	C62610-6	電気及び電子装置用の機械的構造—屋内キャビネットの熱管理—第6部：屋内キャビネットのエア再循環及びバイパス
66	C6803	レーザ製品の安全—光ファイバ通信システムの安全
67	C6821	光ファイバ機械特性試験方法
68	C6837	全プラスチックマルチモード光ファイバ素線
69	C6870-2-30	光ファイバケーブル—第2-30部：屋内ケーブル—終端ケーブルアセンブリに使用するテープ形光ファイバコード品種別通則
70	C6872	光ファイバ—測定方法及び試験手順—ビート長

## 1. 産業標準作成委員会の委員構成表

## 1. 1 電子分野産業標準作成委員会

	氏名	所属	種別
(委員長)	平本 俊郎	東京大学	中立者
(委員)	藤井 哲郎	東京都市大学	
	山田 誠	大阪公立大学	
	服部 恵二	総務省国際戦略局通信規格課	
	諏訪 正樹	KOA 株式会社	生産者
	渋谷 隆	株式会社白山	
	内藤 恵美子	公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサル タント・相談員協会	使用者
	河村 真紀子	主婦連合会	
	松井 隆	日本電信電話株式会社	
	石井 紀彦	日本放送協会	
(関係者)	松井 洋二	経済産業省イノベーション・環境局国際電気標準課	-
(事務局)	鐘築 利仁	一般財団法人日本規格協会	
	桑原 克佳	一般財団法人日本規格協会	
	土屋 秀二	一般財団法人日本規格協会	

## 2. 委員会開催状況

開催年月日	委員会区分	出席者数又は回答者数（名）
2025年12月●日（予定）	産業標準作成委員会	●/●

## 3. 作成審議経過（予定）

- ①産業標準案作成対象テーマの審議（JIS 見直しの審議）、並びに  
産業標準案の作成及び審議（確認の申出に係る審議）；  
2025年12月●日 産業標準作成委員会議決
- ②JIS 作成予定一覧表の公表；  
2025年12月●日～申出予定日（2026年2月下旬）まで JSA ウェブサイト掲載
- ③利害関係者の産業標準作成委員会への参加の確保；  
2025年12月●日～申出予定日（2026年2月下旬）まで JSA ウェブサイト掲載
- ④異議申立ての機会の確保；  
2025年12月●日～申出予定日（2026年2月下旬）まで JSA ウェブサイト掲載
- ⑤議事録及び委員会資料の公開；  
2025年12月●日 JSA ウェブサイト掲載

## 4. 利害関係者の産業標準作成委員会への参加に関する内容（予定）

参加： 無

5. 異議申立てに関する内容及び結果（予定）

異議申立ての有無： 無